This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

JA Utility Model Laid-Open No.: Sho 63-75034

Laid-Open Date

: May 19, 1988

Application No.

: Sho 61-169071

Application Date

: November 5, 1986

Int. Cl

: HO1L 21/032, 21/02, 21/304

Inventor(s)

: Seiichi Watanabe, Fujitsugu Nakatsui,

Ryoji Fukuyama, Hiroyuki Nakata

Applicant

: Hitachi Ltd.

Title of the Device:

Plasma processing apparatus

Scope of the Claim for Utility Model Registration

A plasma processing apparatus having a processing chamber supplied with a processing gas and reduced to a predetermined pressure by exhaustion and an electric discharge device for forming plasmas from the processing gas in a processing chamber, wherein a protective cover is provided to the inner wall of the processing chamber and a heating device is disposed at a position within 1/2 thickness of the protective cover from the inner surface of the protective cover.

Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a vertical cross sectional view showing a plasma processing apparatus as an example of this device,

Fig. 2 is a vertical cross sectional view showing a side wall protective cover of a plasma processing apparatus as a second example of the device,

Fig. 3 is a view showing a temperature distribution upon heater heating along a cross section of a side wall protective cover in the second example.

1 --- chamber, 2 --- insulator, 3 --- lower electrode, 4 --- RF power source, 5 --- upper electrode, 6, 6a --- side wall protective cover, 7 --- heater, 8 --- electric wire, 9 --- quartz, 10 -- metal thin film, 11 -- SiO₂ film,

Fig. 2

Fig. 1

9-19

75034 昭和63-公開実用

多公開 昭和63年(1988) 5 月19日 茨城県土油市沖立町502番地 株式会社日立製作所農局研 茨城県土례山神立町502番地 株式会社日立製作所農城研 阳63-75034 冼城県土油市神立町502番地 株式会社日立製作所裝成研 群馬県高崎市西墳手町111番地 株式会社日立製作所高崎 ① 吳用新案出類公開 ₩ 医查請水 未請水 汉京郡千代田区神田駿河台4丁目6番地 @ 公開実用新案公報(U) ⑩日本国特許庁(JP) 昭61(1986)11月5日 B - 8223-5F 7168-5F D-7376-5F 厅内整理番号 周 昭61-169071 光光力 ĸ ĸ N 株式会社日立製作所 觀別記号 プラズマ処理装置 Œ 塑 苌 ∄ Ħ H 01 L 21/302 21/02 21/304 妲 0 斞 多考案の名称 @Int.Cl.+ む出 類 人び代 理 人 帲 舺 84€ øĸ 84% £4(

が砂油

き

会を

邻

÷ī 뜶 ≊

記案の発布

プラズマ処理教育

実用新楽登録語来の範囲

oi

散け、敷保護カバーの内面より核保護カバーの 処理ガスが供給され所定の圧力に減圧排気さ っ化する故唯手段とを行するプラズマ処理数 **にないて、他に処理後の内部動に保護セバー** れた処理室と、核処理館内の処理ガ を特徴とするプラズマ処理技能。

名後の辞籍な親別

弁理士 小川 勝男

(産業上の利用分野

木男家はプラズマ処理数配に係り、特に処理室 内框に堆積するプラズマ瓜合物の除去に好適なプ

【従来の技術】

ラズマ処理装置

るいはヒータによってチャンパー自体を加熱し、 記載のように、チャンパーの外部から熱交換路

365

火間 63 - 75034 司

チャンパー均根の温度を期節するようになってい

た。

(鬼猴が解釈しょうとする問題点)

上記技来技術は、チャンパー内部に高環保護ない一を設ける場合については配筒されていなかった。チャンパー内部に歯糖保護カバーの熱伝道が合、チャンパー内部と歯様保護カバーの熱伝道が十分では、歯・環境がパーク 内面の温度を上げるのに及いに、歯に保護カバーの商の温度を上げるのに及いに、歯に保護カバーの間の温度を上げるのには、また、歯に保護カバー内面に有数したがある。しかの、上記技来技術においては、チャンパー国体の部を出が大きいために急選に冷却することがB離である。たいう問題点があった。

本考案の目的は、頻優保護カバーの怠熱急冷ができ、プラズマ蛋合物の除去のための放電洗浄の商選化を行なうことのできるプラズマ処理技質を

366

提供することにある。

(問題点を解決するための事役)

上記目的は、処理ガスが供給され所定の圧力に滅圧排気された処理富と、処理窓内の処理ガスをプラズマ化する放電手段とを有するプラズマ処理袋配において、処理窓の内部債に保護カバーを設け、保護カバーの内面より保護カバーの 1/2 の項さ以内の箇所に加熱手段を設けることにより、違政される。

F AB)

、 や理解全体の熱容量に比べ関値保護カバーの熱容量が小さいため、直接、倒環保護カバーを加器すると、 倒電保護カバーを固に推動した ブラズマョウ 合はは 強に 加速に 加速される。 戻に、 放出 洗浄 終了 のが 神時間が 短離される。 更に、 放出 洗浄 終了、 関連保護 カバーの 加熱を終了することにより、 すみやかに 作品に戻り、 半母体の 処理の ための がて ちことが ひきる。 この ため、 加熱、 冷却の ための 時間を 含めた 洗浄 時間 が短縮され、 放出 洗浄 の 高 逃 化を 行 な うことが できる。

367

. e.

(河 鹭 光)

以下、本男家の一実施例を第1四により説明す

رم د 処理窓であるチャンパー1内を図示しない群気 毎曜により箕空排気した後、処理ガスを導入し、 チャンパー1に対し絶縁体2を介して取り付けら れた下部電梯3に高周波電艦4によって高周波電 圧を印加し、上部電極5と下部電極3との間に高 周波放電を生じさせ、下部電極3上に報音するウェハを処理する。 この処理時に、側壁保護カバー 6 の内面には、 プラズマ瓜合機が堆積し、このプラズマ近合膜の 堆積が進むと、やがて鉤離しチャンバー内の発壓 敲となる。このため、定期的に酸※プラズマにより放電洗浄を行なう。

このプラスマ虹合版の除去の放電洗浄は、例えば、石英、セラミック、テフロン等から成る調臨保護カバー 6 の内部に埋め込まれた加熱手段であるヒータ1 に出跡 8 によって電圧を印加し道電加熱することにより、側堰保護カバー 6 の内面が加

他され効率的にプラズヶ面合限を加急することにより行なわれる。

なお、ヒーターによる回旋保護カバー6の泊窓は、ヒーターを創業保護カバー6の内面から倒電保護カバー6の内の内面がの回転の表がパー6の内では、日によって、創業保護カバー6の内面が外側に比べて効率及へが終される。

放電洗浄によるブラズで重合膜の除去現底は、 アレニウスの化学及応速度式に示されるように、 温度とともに急退に増加し、洗浄時間が短縮され 以上、本一実施例によれば、蝴蝶保護カバー6内部にヒーターを埋め込み、熱容量の大きいチャンパー1は加熱せず、蝴蝶保護カバー6を加熱する構造としたため、急熱急冷が可能となり、加熱および冷却の時間も含めた数電洗浄時間を道徹できるという効果がある。

次に、本考案の第2の実施例を第2図ねよび第3図により説明する。

第2図は伽護保護セパー6aの断面構造を示し

金記沙膜10 は石英9上に添拾により形成した2μm 汝而に Si O2 11 なコーティングしている。例えば、 除アルミ腹で、その上にスパッターにより5μm ている。この場合、3個厚の石炭9の上に、パタ ーンニングした金虹 膠膜 10 をヒータとし、 降のSiOz 11をつけたものである。

・ンパー 1の内面と対する関係保護カパー 6 aの 外面は常温に近い温度であるような温度分布が得 うに、プラズマ鹿合物が堆積している側頭保護カ **ヶの**な窓の SiO₂ 11の 早みを十分はくすることにより、第3凶に示すよ - タを同時保護カバー 6 a のプ のなみの 1/2 の厚ま以内の簡所にヒータを埋め込 パー内面は十分加熱されて高温となり、一方、 ラズトにさらされる面より、角素原数カバ んで、ヒータを消散とし、 このように、ヒ 51130

زَ 一旦唯力の供給を停止すると急退に冷却され、瞑 以上、本羽2の実施例によれば、加熱削峻は、 非市に狭い旬城でよいために、金虹鸬ँ以のヒ タに電磁8より供給する電力が少くて済み、更

機保護カバーの内部は在港に添する、したがって、 毎門 -- 実施図に比べた立に他気急をが迅速に行む ヒータの加熱なよび冷却の時間も含めた故 洗净時間が更に短縮するという効果がある

また、上配部2の実施例においては、匈債保護 17.波状のセラミョクを盤布し、その後加熱、乾燥 また、韓酸ヒータの上にヒータ保設機を形成す 5. 题、波状の物質を指布し、中の液理性、充鉄し て形成すれば、スパッターで形成するよりも谷易 り形成したが、たとえばSOO類 (スピン・オン ・グラス版)のように液状の3102を強布し、そ 1 & 0 の後加然,免験することにより形成しても良い。 することによりヒータ保護観を形成しても良い。 の場合においても、上記と回談に遊覧と一タの 上にコーティングする Si O2 11をスパッターに カバーを石灰とした場合について説明したが、 英のかわりに、セラミック等を吊いても良い。 なお、第2の実施内においては、声原に に行なえる。

さらに、本実施倒では放出手収として平行平板

371

型の電影構造のものについて述べたが、BCR数 爪を向いたものでもはい。

図

7

(光彩の効果)

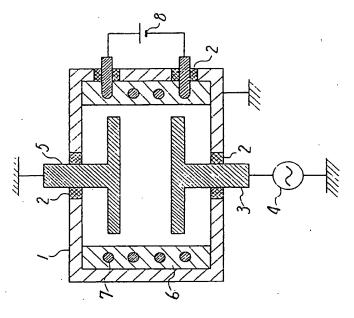
洗净時間を短縮でき、故服洗浄の隔离化を行なう **水考案によれば、プラスマ蛋合物が堆積した側** 原保護カバーを直接加熱できるので、動熱動治が 可能であり、加熱ねよび冷却の時間を含めた故境 ことができるという効果がある。

改而の簡単在設問

示于模斯间区、第3区は第20块箱则における则 原保護カバーの断面でのヒータ加熱時の温度分布 第1四は本地楽の一曳猫倒であるプラスマ処理 校许を示す校時面図、第2図は本名祭の第2の実 徳例であるプラズコ処理់数盟の闽臨保護カバーを を示す図である。

チャンバー、2 …… 稻様体、3 …… 下部 5 上部电极、 金灿褐膜、11 …… 其格、 4 …… 高周波循道、 6 a 包耐尿器 ホバー、 **뱁椒、9 …… 石英、10 ……** 02 題

些 Ξ ÷ 并與士 イヨン



5---上部电极 1--- 7011-

372

